



Strumento di Controllo Qualità

X-Rite Ci™52

Spettrofotometro da tavolo

Strumento flessibile per la misurazione coerente di una vasta gamma di campioni in una varietà di materiali, dimensioni, forme, texture e livelli di opacità. La misurazione simultanea del colore e dell'aspetto migliora la precisione. Un sistema compatibile con NetProfiler3 garantisce prestazione coerente e precisa.



Vantaggi dello strumento X-Rite Color i52

Versatile. Può essere utilizzato per entrambe le applicazioni portatile o da banco; il pulsante di lettura remota aggiunge praticità

Facile da usare. Funzionamento del tipo chiudere-e-azionare supportato dai indicatori di stato visivo (LED) e acustico

Integrità di misurazione avanzata. La base bersaglio con capovolgimento ed un sistema ammortizzante, inoltre all'attivazione delle misurazioni remote lo rendono facile misurare i campioni difficili da manipolare.

Accetta un'ampia gamma di campioni e dimensioni. Capacità di misurazione di 14 mm o più grandi su materiali come carta, plastica, tessuto e una varietà di superfici dure

Letture esatte e veloci. Tempo di misurazione di 2 secondi su campioni piani standard e forme complesse

Prestazione affidabile. Misurazione simultanea dei componenti speculari incluso (colore) ed escluso (aspetto) attivata per determinare l'influenza del componente speculare

Misurazioni coerenti. Alta concordanza interstrumentale che assicura l'integrità del controllo colore di vari strumenti.

Compatibile con NetProfiler®3. Il sistema incorporato ottimizza la prestazione dello strumento e permette la certificazione remota

Transizione perfetta. Opera in accordo con gli spettrofotometri X-Rite SP64, SP62 e SP60

Vantaggi dello strumento X-Rite Color i52

Geometria di misurazione	d/8°, meccanismo spettrale DRS,
apertura di misurazione:	Area di misurazione 8mm Finestra obiettivo di 14 mm
Sorgente di luce	lampada al tungsteno con gas inerte
Ricevitore	Fotodiodi al silicio amplificati per blu
Gamma spettrale	400 – 700 nm
Intervallo Spettrale	10 nm – misurazioni 10 nm – output
Intervallo di misurazione	0 - 200% riflettanza
Tempo di misurazione	Appross. 2 secondi
Accordo inter-strumentale	CIE L*a*b*: Media 0.30 ΔE*ab in media sul riferimento insieme 12 ceramiche BCRA Series II (componente speculare incluso) 0.50 ΔE*ab massimo su qualsiasi ceramica (componente speculare incluso) 0.10 ΔE*ab su ceramica bianca
Ripetibilità a Breve Termine	0.10 ΔE*ab su ceramica bianca
Supporto incorporato a NetProfiler®	
Vita Utile della Lampada	Appross. 500000 misurazioni
Alimentazione elettrica	Alimentazione elettrica dell'adattatore CA 90-130 V AC o 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz, 15 W massimo
Interfaccia dati	USB
Intervallo temperatura di operatività	50° F a 104° F (10° C a 40° C)
Umidità relativa massima 85% (senza condensa)	
Gamma di Temperatura di Immagazzinamento	-4° F a 122° F (-20° C a 50° C)
Peso	1.9 lb (0,87 kg)
Dimensioni	Altezza: 10,9 cm (4.3") x larghezza: 9,1 cm (3.6") x lunghezza: 21,3 cm (8.4") (10,9 cm 8,4 cm 19,6 cm)
Accessori forniti	Standard di calibrazione: collettore nero, standard bianco rimovibile, manuale dell'operatore, adattatore CA, cavo USB con dispositivo anti-trazione
Opzioni	Appoggio da banco opzionale accessori per presentazione di campioni



X-RITE WORLD HEADQUARTERS

Grand Rapids, Michigan USA • (800) 248-9748 • +1 616 803-2100 • xrite.com

©2011, X-Rite, Incorporated. All rights reserved. L10-447-TextileIT (05/11)

